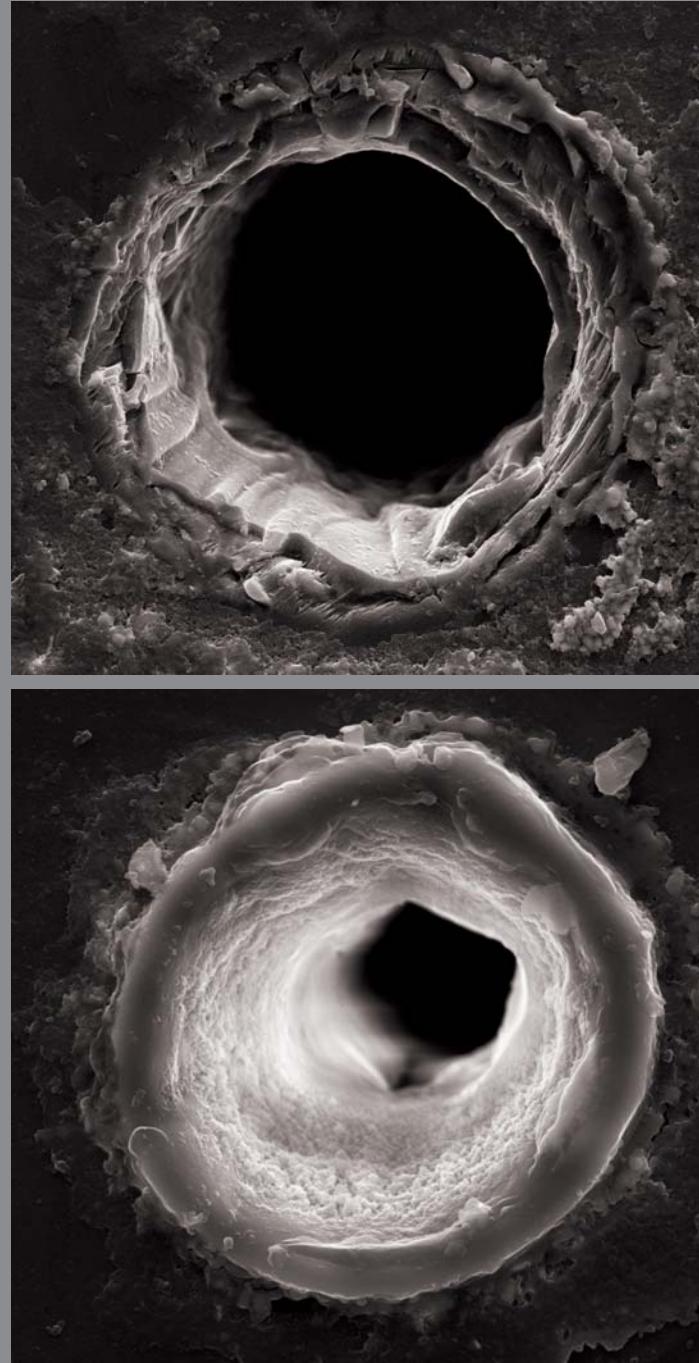




MINISTERSTWO  
ŚRODOWISKA

# przegląd **GEOLOGICZNY**



## X KONFERENCJA **ANALITYKA W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII, GEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA**

Warszawa, 21–22.10.2009

**Zdjęcie na okładce:** Ślady po analizie chemicznej metodą ablacji laserowej połączonej ze spektrometrią mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (LA-ICP-MS) w obrazie mikroskopu elektronowego (BSE). Zdjęcia po prawej stronie przedstawiają powiększone obrazy skaningowe kraterów powstały po zastosowaniu wiązki lasera (Nd:YAG 266 nm) o średnicy jedynie 25 µm (głębokość krateru 100 µm). Za pomocą metody LA-ICP-MS można *in situ* określić skład chemiczny próbki geologicznej i oznaczyć zawartość pierwiastków śladowych. Fot. L. Giro (patrz str. 1067)

**Cover photo:** Backscattered Electron (BSE) image featuring traces resulting from chemical analysis carried out by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS). Photos in the right show enlarged BSE images of craters 100 µm in depth, formed by ablation with laser beam (Nd:YAG 266 nm) only 25 µm in diameter. The LA-ICP-MS method makes possible determinations of chemical composition of geological samples and content of trace elements. Photo by L. Giro (see page 1067)